タウ物理のための検出器 R&D

名古屋大学 N研 M1 冨田 光俊

- -Contents-
- •Introduction
- •光検出器
 - -MCP-PMT
 - -角型マルチアノードMCP-PMT

•まとめ

Introduction

●新型リングイメージ型π/K粒子識別装置 · · · Bar-TOP counter







光検出器

• 光検出器に要求される性能



- **2.** 1光子での時間分解能 < 50ps
- 3. 磁場中で使用可能(B=1.5T)
- 4. 収集効率 50%
- 5. 位置分解能 ~ 5 mm

全ての要求を満たす光検出器はまだ存在しない



Micro Channel Plate(MCP)-PMT

MCP(マイクロチャンネルプレート) ■ 直径数µm~数十µmの細いガラスパイプチャン ネルを多数束ねた板状構造 ■ 各ガラスパイプが独立した2次電子増倍部 ■ MCPの両端に印加された電圧で電子が加速され MCPに衝突し、2次電子を放出 MCP-PMTの特徴 1. 高Gain (MCP2枚で10⁵~10⁶) 2. 高時間分解能 (MCP1枚が1mm以下) 高磁場で使用可能(垂直に磁場をかける) 3. 入射電子 MCP アノード 光雷面 入力側電樹 光電子 光子 MCP-PMTの構造







研究目的

Bar-TOP counterに用いるための光検出器の研究開発 1~5の性能が要求される

 仕様の異なる4種のシングルアノードのMCP-PMTの研究 磁場中における

|1光子照射時の時間分解能

→ 高い性能を示すMCP-PMTの構造

MCP-PMTの仕様

HPK6	Russia10	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	X10	Burle25
MCP-PMT	HPK6	Russia10	HPK10	Burle25
型番号	R3809-U-50-11X	N4428	R3809-U-50-25X	85011-501
PMTの径(mm)	45	30.5	52	71x71
有効光電面(mm)	11	18	25	50x50
MCPの枚数	2	2	2	2
<mark>MCPチャンネル</mark> 径D(µ m)	6	10	10	25
規格長(=L/D)	40	43	40	40
最大の印加電圧 (V)	3600	3200	3600	2500
	マルチアルカリ	マルチアルカリ	マルチアルカリ	バイアルカリ

QE(%) (

=408nm)

科研費特定領域 第二回研究会

18

26

24

26

波形

(磁場=0T、電圧は各MCP-PMTの最大電圧)









MCP-PMT	HPK6	Russia10	HPK10	Burle25
Rise time(ns)	0.3	1	0.4	0.8

1光子照射

ADC分布



ADC v.s. TDC (B=1.5T)



磁場 v.s. Gain



- HPK6、Russia10: 高磁場中でも10⁶の高Gain
- Burle25:磁場1.0T以上ではGainが低下→測定不可能

2004/3/9

磁場中における2次電子のMCPチャンネル内での運動



加速距離



MCPのチャンネルを横から見た図

2004/3/9

2次電子の衝突エネルギー

衝突エネルギーはMCPからの2次電子放出数に関係

電子がMCPに衝突し、2次電子を放出する最低エネルギーは20eV



Burle25:1.0T以上で20eV以下!!

1.0T以上では電子増幅が起こらず測定できない(実験結果と合致)

高磁場中ではチャンネル径の小さいMCP-PMTが有効



Gain vs 時間分解能



<u>40ps以下の高時間分解能を得るためには、106以上のGainが必要</u>

収集効率

 基準PMT:
 量子効率、収集効率ともに既知で1光子の信号とノイズが

 分離できるPMT、H3171-04(No.LA9806)を使用

➡ 同じ光量で測定し比較することにより収集効率を導出 収集効率に関わる点

・開口率・・・MCP表面の全面積に対するチャンネルの開口面積の比率
 ・AI膜・・・・イオンフィードバック防止のためにMCP表面にある(透過率~60%)





Russia10(開口率40%,Al膜無)

Burle25(開口率30%,Al膜無)

平均

30.5

磁場(0T~0.2T)

収集効率(%)

磁場(0T~1.5T)	平均
収集効率(%)	44

HPK6(開口率60%,Al膜有)

磁場(0T~1.5T)	平均
収集効率(%)	35.5

HPK10(開口率60%,Al膜有)

磁場(0T~1.0T)	平均
収集効率(%)	30.3

<u>開口率(%) ≅ 収集効率(%)</u> (A1膜無し) ↓ ▲ AI膜がなく、開口率50%以上のMCP-PMT

角型マルチアノードMCP-PMT

仕様の異なる4種のMCP-PMTを用いて、磁場中での性能について研究

高磁場中ではチャンネル径の小さいMCP-PMTが有効 ~40psの高時間分解能を得るためには10⁶以上のGainが必要 MCP表面のAI膜を除くことにより、収集効率が向上する

・磁場に対する耐性からチャンネル径を10µm以下
 ・高時間分解能を得るためGainを10⁶以上
 ・MCP表面のAI膜無し、開口率を50%以上

<u> 光検出器に要求する性能</u>

(1)1光子が検出可能
(2)高時間分解能 40~50ps
(3)1.5Tの磁場中で使用可能(角度付)
(4)収集効率 50%
(5)位置分解能

↓ リニアアレーのマルチアノード



角型マルチアノード MCP-PMT仕様



27.5mm



基本性能 (B=0T,HV:3.5kV)



2004/3/9

B v.s. Gain,時間分解能



磁場に対するGain,TTS

■ 最大電圧(3.5kV)では、B=1.5Tでも10⁶以上のGainが得られる

10⁶のGainが得られれば磁場に対して時間分解能が悪化する振る舞いは見られない

角型マルチアノードMCP-PMTの性能

•Gain,時間分解能, 収集効率 (1光子照射)





2004/3/9

まとめ

・仕様の異なる4種のシングルアノードMCP-PMTの、磁場中での性能について研究



- ・TOP counter用のリニアアレーマルチアノードMCP-PMTを 開発し、性能評価を行った。
 - 1.1光子検出可能
 1光子での時間分解能 ~ 30ps
 3.磁場中で使用可能(B=1.5T)
 4.収集効率 50%
 5.位置分解能 ~ 5 mm

今回開発した角型マルチアノードMCP-PMTは期待通りの性能を示した

Back up

波高分解能の向上

・無磁場、磁場中でのMCP中の2次電子流



SET UP@KEK-PS





HPK6、HPK10:AI膜が蒸着 AI膜の透過率~60%、開口率60% → 収集効率~36%

AI膜が収集効率を低下させる

光検出器に要求する性能 (4) 収集効率 50%

→ A1膜が蒸着されている場合、開口率が80%以上必要:不可能 AI膜が無いRussia10は高Gain、高時間分解能

(イオンフィードバックによる悪影響はない)



AI膜蒸着がなく、開口率50%以上のMCP-PMT

Set up@HPK







2004/3/9

位置分解能の原理



位置分解能



磁場に対する位置分解能 ■ 位置分解能は5mm以下(アノードのチャンネルサイズ)

チャンネル間の性能のばらつき



イオンフィードバックについて イオンフィードバックの影響 光電子増倍管内の残留ガスが電子によりイオン化され、この内の陽イオンが 光電面に戻ること(イオンフィードバック)により多数の光電子を発生させる。 アフターパルス (通常、本信号から数十ns~数µs遅れる) ft. 今回のPMTも複数光子照射すると、約 Ces Al +nsにアフターパルスが見える。

(原因がイオンフィードバックかは分かっていない)

しかし、1光子照射では新品であることもありアフターパルスは 見えない。→→ 時間分解能に悪影響はない

角型マルチアノードMCP-PMT

2chOgain



角型マルチアノードMCP-PMT 2chのTDCのRMSとTDC-mean FDC-mean(25psec/count カソード TDC-mean y=0.0mm TDC-mean v=1.5mm RMS v=0mn DC-mean v=3.0ml RMS(count) RMS y=1.5mm DC-mean v=4.5mn 17369 TDC-mean v=6.0mm RMS y=3.0mm TDC-mean v=7,5mm н RMS y=4.5mm TDC-mean y=9.0mm DC-mean v=10 5n RMS y=6.0mm MCP RMS v=7.5mm 1734 RMS y=9.0mm RMS y=10.5mm 0.5count 1732 2count 3 1730 1728 0 2 3 5 4 6 0 2 3 5 X(mm)X(mm) • RMSは場所によらず 0.5 count 以内 •カソード、MCP間の距離が一定 TDC-meanの場所によってのふらつき小(~2count) チャンネル全体で時間分解能は変化なし

(spot: ~ 35psec, all: ~ 35psec)

今後の課題

·Cross Talk





- $\frac{S}{N} = \frac{本信号のpulse-height}{Cross-talkのpulse-height} = \frac{7}{1}$
 - $\frac{-\text{height}}{\text{lse-height}} = \frac{750\text{mV}}{150\text{mV}} = 5$

Cross-talkが本信号に対して、非常に大きい。

今後の課題

Cross-talk



Cross-talk 原因調查



Cross-talk 対策

